



<b>Title of Change:</b>	SOT223 Seremban Dual Source Qualification Project	
<b>Proposed First Ship date:</b>	25 Sep 2020 or earlier if approved by customer	
<b>Contact Information:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or RamilAngelo.Nonato@onsemi.com	
<b>PCN Samples Contact:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com>. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
<b>Type of Notification:</b>	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact <PCN.Support@onsemi.com>	
<b>Marking of Parts/ Traceability of Change:</b>	Different package marking between Cebu and Seremban	
<b>Change Category:</b>	Assembly Change, Test Change	
<b>Change Sub-Category(s):</b>	Shipping/Packaging/Marking, Manufacturing Site Addition	
<b>Sites Affected:</b>		
<b>ON Semiconductor Sites</b>	<b>External Foundry/Subcon Sites</b>	
ON Semiconductor Seremban, Malaysia	None	
<b>Description and Purpose:</b>		
	<b>Before Change Description</b>	<b>After Change Description</b>
Mold Compound	MC GREEN KTMC5200G	Cebu - MC GREEN KTMC5200G Seremban - MC EME-G700HC
Assembly Site	ON Semiconductor Philippines - Cebu	ON Semiconductor Philippines – Cebu ON Semiconductor Malaysia – Seremban
Test Site	ON Semiconductor Philippines - Cebu	ON Semiconductor Philippines – Cebu ON Semiconductor Malaysia – Seremban
Product marking change	Ex-FSC Format Marking	Cebu Site - FSC Format Marking Seremban Site - ON Format Marking

**Qualification Plan:****QV DEVICE NAME: FDT439N****RMS: F60971****PACKAGE: SOT223 4L CU SNGL PBF**

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150 °C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to + 150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

**QV DEVICE NAME: NDT3055****RMS: F61297****PACKAGE: SOT223 4L AU SNGL PBF**

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150 °C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to + 150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	



QV DEVICE NAME: FDT86102LZ

RMS: F60928

PACKAGE: SOT223 4L CU SNGL HPBF

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150 °C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to + 150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

QV DEVICE NAME: FDT86244

RMS: F60931

PACKAGE: SOT223 4L CU SNGL HPBF

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150 °C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to + 150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	



QV DEVICE NAME: FDT3612 (TJ Fab)

RMS: F60932

PACKAGE: SOT223 4L CU SNGL PBF

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150 °C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to + 150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

QV DEVICE NAME: FDT3612 (BK Fab)

RMS: F60933

PACKAGE: SOT223 4L CU SNGL PBF

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150 °C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to + 150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	



**List of Affected Parts:**

*Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.*

Part Number	Qualification Vehicle
NDT3055	NDT3055
FDT86244	FDT86244
FDT86113LZ	FDT86102LZ
NDT014L	NDT3055
NDT014	NDT3055
FDT1600N10ALZ	FDT86102LZ
FDT86106LZ	FDT86102LZ
FDT86246	FDT86102LZ
FDT457N	FDT439N
FDT439N	FDT439N
FDT434P	FDT3612
FDT86246L	FDT86102LZ
FDT86102LZ	FDT86102LZ
NDT3055L	NDT3055
FDT3612	FDT3612
NDT2955	FDT3612

Japanese translation of the notification starts here.  
通知の日本語訳はここから始まります。

*Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



## 初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN22970X

発行日: 4 Dec 2019

変更件名:	SOT223 セレンバンデュアルソース認定プロジェクト	
初回出荷予定日:	25 September 2020 (またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前)	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <RamilAngelo.Nonato@onsemi.com> にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、<PCN.Support@onsemi.com> にお問い合わせください。	
変更部品の識別:	セブとセレンバンのパッケージマーキングの違い	
変更カテゴリ:	アセンブリの変更, 検査の変更	
変更サブカテゴリ:	出荷/梱包/マーキング、製造拠点の追加	
影響を受ける拠点:		
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
ON Semiconductor Seremban, Malaysia	なし	
説明および目的:		
	変更前の表記	変更後の表記
モールド・コンパウンド	MC GREEN KTMC5200G	Cebu - MC GREEN KTMC5200G Seremban - MC EME-G700HC
組立拠点	ON Semiconductor Philippines - Cebu	ON Semiconductor Philippines – Cebu ON Semiconductor Malaysia – Seremban
検査拠点	ON Semiconductor Philippines - Cebu	ON Semiconductor Philippines – Cebu ON Semiconductor Malaysia – Seremban
製品マーキング変更	Ex-FSC フォーマットマーキング	Cebu Site - FSC フォーマットマーキング Seremban Site - ON フォーマットマーキング



## 認定計画:

デバイス名: FDT439N

RMS: F60971

パッケージ: SOT223 4L CU SNGL PBF

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150 °C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to + 150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

デバイス名: NDT3055

RMS: F61297

パッケージ: SOT223 4L AU SNGL PBF

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150 °C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to + 150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	





デバイス名: FDT86102LZ

RMS: F60928

パッケージ: SOT223 4L CU SNGL HPBF

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150 °C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to + 150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

デバイス名: FDT86244

RMS: F60931

パッケージ: SOT223 4L CU SNGL HPBF

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150 °C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to + 150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	



デバイス名: FDT3612 (TJ Fab)

RMS: F60932

パッケージ: SOT223 4L CU SNGL PBF

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150 °C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to + 150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

FDT3612 (BK Fab)

RMS: F60933

PACKAGE: SOT223 4L CU SNGL PBF

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta= 150 °C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150 °C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to + 150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	



## 影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
NDT3055	NDT3055
FDT86244	FDT86244
FDT86113LZ	FDT86102LZ
NDT014L	NDT3055
NDT014	NDT3055
FDT1600N10ALZ	FDT86102LZ
FDT86106LZ	FDT86102LZ
FDT86246	FDT86102LZ
FDT457N	FDT439N
FDT439N	FDT439N
FDT434P	FDT3612
FDT86246L	FDT86102LZ
FDT86102LZ	FDT86102LZ
NDT3055L	NDT3055
FDT3612	FDT3612
NDT2955	FDT3612